

SCMによる イメージセンサの拡散層形状評価

試料解体から測定まで一貫して対応します

測定法 : SCM
製品分野 : 光デバイス
分析目的 : 形状評価・製品調査

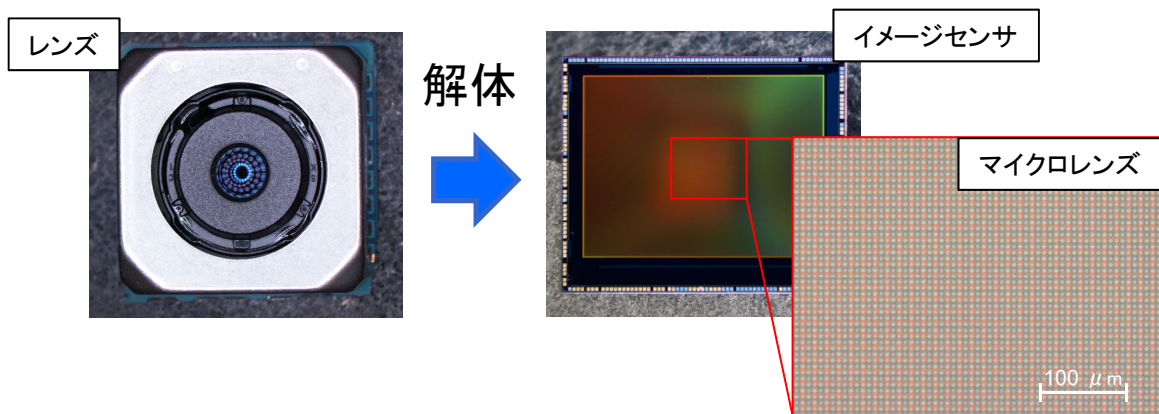
概要

本資料では、スマートフォン搭載のイメージセンサ拡散層に関して評価した事例をご紹介します。
半導体のp/n型を判定可能なSCM(走査型静電容量顕微鏡)を用い、拡散層がどのような分布となっているかを評価しました。今回、断面と平面のSCM結果を組み合わせることで、相補的かつ広範囲の情報が得られました(次頁)。
SCMは、イメージセンサ拡散層の出来映え評価や故障解析に有効なツールの一つです。

データ

■ サンプル概要

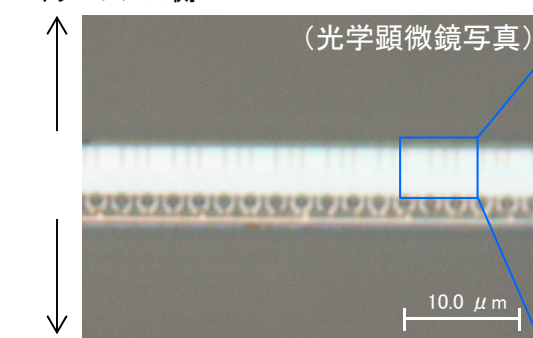
スマートフォンを解体し、取り出したレンズの中のイメージセンサを評価しました。



■ 分析結果

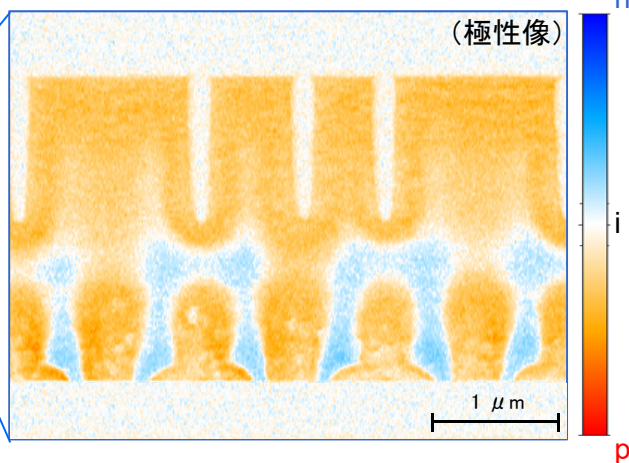
・イメージセンサを断面方向にSCM分析した結果

マイクロレンズ側



支持基板側

断面SCM分析



✓ 製品の解体から対応します。

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <https://www.mst.or.jp/>

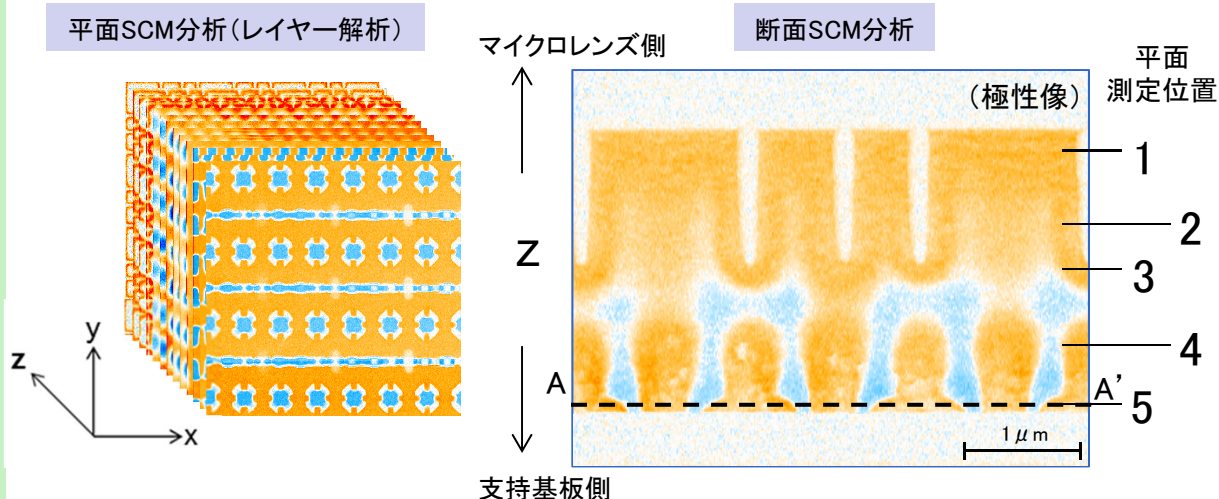
SCMによる イメージセンサの拡散層形状評価

試料解体から測定まで一貫して対応します

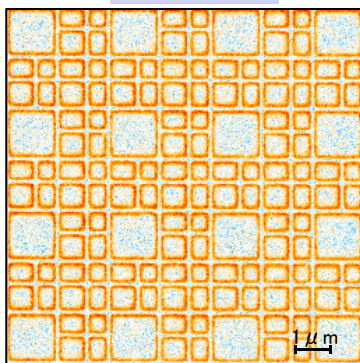
測定法 : SCM
製品分野 : 光デバイス
分析目的 : 形状観察・製品調査

データ

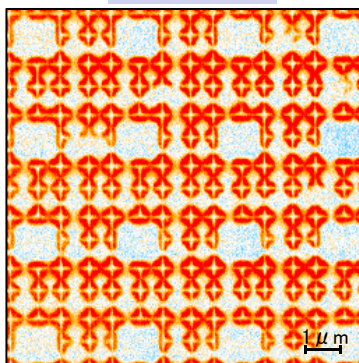
・イメージセンサを平面方向にSCM分析した結果



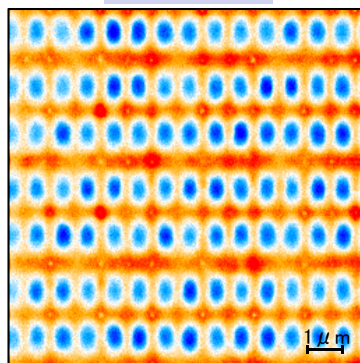
平面SCM 1



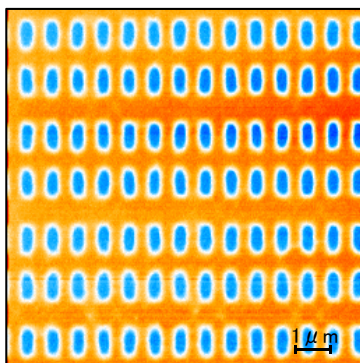
平面SCM 2



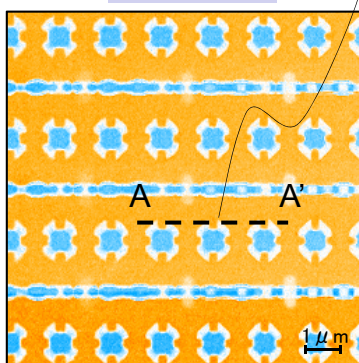
平面SCM 3



平面SCM 4



平面SCM 5



断面SCM対応箇所



Point

- ✓ 位置精度よく、着目箇所
のSCM 分析を行うことが可能です。
- ✓ 平面分析では各層ごとに
レイヤー解析が可能です。
- ✓ 断面および平面方向で
分析することで広範囲
の情報を取得可能です。

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <https://www.mst.or.jp/>